

様式第4号（第6条関係）

試験成績書

成績書番号	I00-0000-00	
依頼者	住所	
	団体名	
	代表者名又は氏名	—
依頼品名		
依頼事項 <small>※依頼事項の明細については、依頼試験依頼書に記載のとおりです。</small>	X線回折装置による分析	
記		
上記依頼品のX線回折装置による分析結果は別添のとおりです。		
備考：測定装置 株式会社リガク SmartLab(9kW)-RPA		
以下余白		
令和 年 月 日付で依頼を受けた依頼試験（受付番号第 I00-0000 号）の結果は、上記のとおりです。		
令和 年 月 日		
埼玉県産業技術総合センター長		

# 見本

成績書例.ras

試料名	:	スキャンモード	:	CONTINUOUS	入射スリット	:	1/2deg
コメント	:	スキャンスピード/計数時間	:	5.0000	長手制限スリット	:	10.0mm
測定日	:	ステップ幅	:	0.0100 deg	受光スリット1	:	8.000mm
測定者	:	スキャン軸	:	2 $\theta$ / $\theta$	フィルター	:	Cu_K-beta
解析日	:	スキャン範囲	:	3.0000 - 90.0000 deg	受光光学素子	:	No_unit
解析者	:	2 $\theta$	:	0.0000 deg	受光平行スリット	:	Soller_slit_5.0deg
X線出力	:	$\omega$	:	0.0000 deg	受光スリット2	:	13.000mm
波長	:	$\chi$	:		アッテネーター	:	Open
ゴニオメーター	:	$\phi$	:	0.0000 deg	検出器モノクロメーター法	:	None
アタッチメントベース	:	2 $\theta$ $\chi$	:	0.0000 deg	モノクロメータースリット	:	None
アタッチメント	:	CBO選択スリット	:	BB	光学系属性	:	集中法
検出器	:	入射平行スリット	:	Soller_slit_5.0deg			
メモ	:						

